## ЭЛЕКТРОНИКА И РАДИОТЕХНИКА

УЛК 621.314

## ДИНИСТОРНЫЙ КОММУТАТОР МОЩНЫХ НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ

© 2023 г. С. В. Коротков<sup>а,\*</sup>, Ю. В. Аристов<sup>а</sup>, К. А. Козлов<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26 \*e-mail: korotkov@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию 03.03.2023 г.

После доработки 11.03.2023 г. Принята к публикации 12.03.2023 г.

Описан мощный коммутатор на основе блока динисторов с ударной ионизацией, который имеет рабочее напряжение 16 kB и способен на частоте 300 Гц коммутировать наносекундные импульсы тока с амплитудой  $\sim 3 \text{ кA}$ . Приведены результаты компьютерного моделирования процесса его включения, определены перспективы увеличения коммутируемой мощности.

DOI: 10.31857/S0032816223040134, EDN: RBDVWO

Высокая эффективность полупроводниковых коммутаторов наносекундных импульсов тока может быть обеспечена только при очень малом времени их переключения в хорошо проводящее состояние. В настоящее время наименьшее время включения имеют описанные в работах [1-3] четырехслойные кремниевые структуры, которые запускаются наносекундным импульсом напряжения, нарастающим со скоростью >1 кВ/нс. Такой способ запуска был предложен в работе [4]. Он обеспечивает нарастание напряжения на полупроводниковой структуре до величины, существенно превышающей напряжение стационарного пробоя, время развития которого составляет десятки наносекунд. В результате напряженность поля в базовых областях полупроводниковой структуры становится достаточной для инициирования процесса ударной ионизации кремния. Процесс ударной ионизации позволяет обеспечить высокую проводимость за время <1 нс.

В работах [5—7] описаны оригинальные четырехслойные кремниевые структуры с субнаносекундным временем включения — динисторы с ударной ионизацией (SID — Shock Ionized Dynistors). Их основное достоинство — возможность эффективно включаться при сравнительно малой мощности запускающего воздействия.

Принцип работы SID позволяет включать высоковольтные блоки последовательно соединенных SID-структур общим наносекундным импульсом высокого напряжения. В работе [8] приведены результаты исследования блока SID с рабочим напряжением 12 кВ, состоящего из шести последовательно соединенных опытных SID-

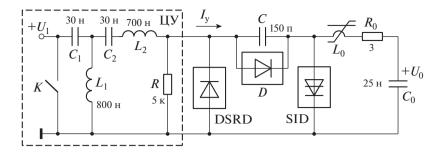
структур, имеющих диаметр 24 мм. Эффективное включение этого блока достигалось, когда выходное напряжение цепи управления (ЦУ) нарастало со скоростью более 5 кВ/нс, а выходной ток ЦУ в процессе переключения SID-структур был не менее 300 А.

В данной статье приведены результаты исследования более мощного блока SID, с рабочим напряжением 16 кВ, состоящего из восьми динисторных структур, имеющих диаметр 24 мм, которые были изготовлены в условиях промышленного производства в ПАО "Электровыпрямитель" (г. Саранск, Россия).

Для проведения исследований был разработан генератор мощных наносекундных импульсов. Его электрическая схема показана на рис. 1.

В схеме на рис. 1 зарядное напряжение  $U_0$  накопительного конденсатора  $C_0$  первоначально приложено к блоку SID и к цепи C-D. Включение блока SID осуществляется с помощью размыкающего ключа с наносекундным временем выключения, выполненного в виде блока последовательно соединенных дрейфовых диодов с резким восстановлением (DSRD — Drift Step-Recovery Diodes), впервые описанных в работе [9]. Эффективная работа блока DSRD обеспечивается ЦУ, которая подробно описана в работе [10]. Она разработана на основе схемотехнического решения, представленного в работе [11].

Принцип действия схемы на рис. 1 заключается в следующем. После включения ключа K конденсатор  $C_1$  быстро перезаряжается. Ток перезарядки протекает через цепь  $\mathrm{DSRD-}L_2-C_2$  и через



**Рис. 1.** Электрическая схема опытного генератора.  $L_0$  — один виток, сердечник — феррит N87 (EPCOS), 2 кольца размером 29.5 × 19 × 14.9 мм; D — K100F (2 последовательно); DSRD — 35 диодных структур, имеющих диаметр 20 мм; SID — 8 динисторных структур, имеющих диаметр 24 мм; K — высоковольтный интегральный импульсный тиристор [12].

индуктивность  $L_1$ . В результате происходит зарядка конденсатора  $C_2$ , и через блок DSRD в прямом направлении протекает принципиально короткий ток, обеспечивающий эффективное накопление заряда в DSRD-структурах. Длительность этого тока составляет ~300 нс. Затем конденсаторы  $C_1$ ,  $C_2$  разряжаются по цепи  $L_2$ —DSRD, и через блок DSRD в обратном направлении протекает быстро нарастающий ток, который за время ~200 нс выносит из DSRD-структур весь накопленный заряд. В результате блок DSRD выключается за время ~2.5 нс, и ток  $I_y$  (~350 A), протекающий через индуктивность  $L_2$ , коммутируется в цепь C—SID.

Ток  $I_{\rm y}$  осуществляет перезарядку конденсатора C и быструю зарядку собственной емкости  $C_{\rm SID}$  блока SID ( $C_{\rm SID} \ll C$ ). В результате напряжение на динисторных структурах резко нарастает до величины напряжения переключения. В процессе включения SID-структур через них продолжает протекать ток  $I_{\rm y}$ , который обеспечивает высокую интенсивность процесса ударной ионизации. До момента включения блока SID дроссель  $L_0$  имеет

большую индуктивность и исключает возможность перераспределения тока  $I_{\rm y}$  в цепь конденсатора  $C_0$ . Сердечник дросселя  $L_0$  насыщается спустя несколько наносекунд после включения блока SID. В результате индуктивность дросселя уменьшается, и ток  $I_0$  разряда конденсатора  $C_0$  резко нарастает. В интервале между моментом включения блока SID и моментом насыщения сердечника дросселя  $L_0$  через блок SID протекает ток цепи управления, обеспечивающий высокую проводимость SID-структур. Такой режим достигается благодаря использованию диодного блока D.

На рис. 2 показана осциллограмма напряжения на блоке SID в процессе его переключения. Она получена при использовании в цепи разряда конденсатора  $C_0$  токоограничивающего резистора с сопротивлением 500 Ом. Осциллограмма измерена при использовании опытного высоковольтного делителя напряжения с сопротивлением  $\sim$ 500 Ом, который калибровался при измерении импульсов напряжения с фронтом 300 нс с помощью генератора

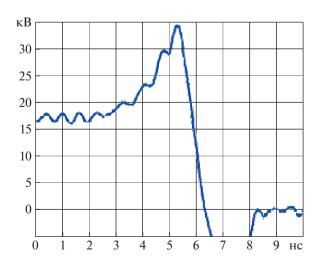
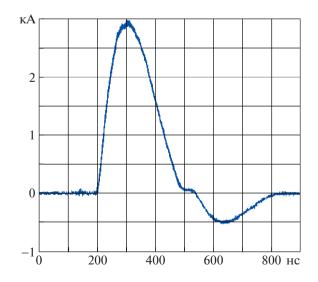
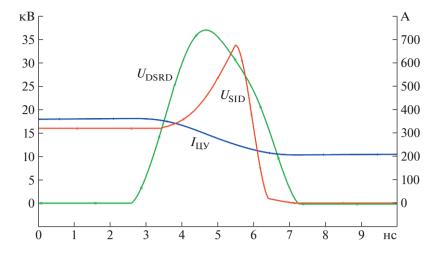


Рис. 2. Осциллограмма напряжения на блоке SID.



**Рис. 3.** Осциллограмма тока через блок SID.

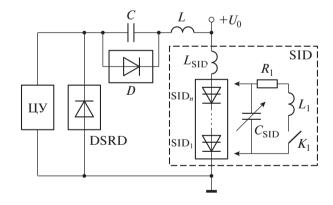


**Рис. 4.** Расчетные кривые напряжения на блоке SID ( $U_{\text{SID}}$ ), выходного тока цепи управления ( $I_{\text{ЦУ}}$ ) и напряжения на блоке DSRD ( $U_{\text{DSRD}}$ ).

LeCroy 9210. Делитель подключался к блоку SID через малогабаритный конденсатор.

На рис. 3 приведена осциллограмма тока через блок SID, полученная на частоте 300 Гц при напряжении  $U_0 = 16$  кВ. Амплитуда тока составляет ~3 кА, длительность ~250 нс. Осциллограмма измерена с помощью малогабаритного датчика тока, разработанного в фирме Pearson Electronics.

На рис. 4 приведены результаты компьютерного моделирования процесса включения блока SID, выполненного с помощью пакета программ OrCAD. Кривые  $I_{\rm Hy},\ U_{\rm SID},\ U_{\rm DSRD}$  иллюстрируют



**Рис. 5.** Моделируемая схема коммутатора на основе блока SID. ЦУ, C, D — цепь управления и разделительные элементы, соответствующие схеме на рис. 1; DSRD — блок диодов с напряжением статического пробоя  $1.3 \, \mathrm{kB}$ ; SID — блок динисторов с напряжением статического пробоя  $2.7 \, \mathrm{kB}$ ; SID $_1$ , SID $_n$  — динисторные структуры; L,  $L_{\mathrm{SID}}$  — монтажные индуктивности;  $C_{\mathrm{SID}}$  — суммарная емкость динисторных структур;  $R_1$ ,  $L_1$ ,  $K_1$  — элементы цепи, моделирующей включение блока SID.

выходной ток цепи управления и падение напряжения на блоках SID и DSRD.

Моделируемая схема показана на рис. 5. Блок SID в процессе нарастания запускающего напряжения моделировался как блок обратносмещенных диодов. В качестве этих диодов и диодов блока DSRD использовались модели диодов из пакета программ OrCAD. Коэффициенты в формулах, описывающих вольт-фарадные характеристики диодов OrCAD, выбирались так, чтобы получить совпадение с зависимостями, измеренными для структур DSRD и SID в диапазоне напряжений до 300 В. Время жизни в моделях диодов OrCAD задавалось ~10 мкс. Включение блока SID моделировалось включением ключа  $K_1$ . Величина напряжения включения ключа  $K_1$  определялась как сумма напряжений включения динисторных структур блока SID. Величина этих напряжений (~4 кВ) задавалась исходя из результатов исследования используемых SID-структур, проведенного на стенде, описанном в работе [7]. Величины  $L_{\rm SID} =$ 20 нГн,  $L_1 = 10$  нГн и  $R_1 = 50$  мОм подбирались таким образом, чтобы расчетная кривая напряжения  $U_{\mathrm{SID}}$  хорошо соответствовала осциллограмме на рис. 2.

Таким образом, результаты исследований разработанного блока SID с рабочим напряжением 16 кВ свидетельствуют о его высокой эффективности в режиме коммутации мощных наносекундных импульсов тока. Принцип работы рассмотренного блока SID позволяет увеличивать коммутируемую мощность путем увеличения рабочего напряжения, определяемого количеством последовательно соединенных SID-структур. Недостатком такого решения является то, что при большом количестве SID-структур чрезмерно увеличивается выходное напряжение цепи управления. Так, например, при запуске блока SID с рабо-

чим напряжением 24 кВ расчетное напряжение на блоке DSRD составляет ~53 кВ. Такое напряжение требует создания соответствующей изоляции с использованием специальных изолирующих материалов. Поэтому рассмотренную схему SID-коммутатора с одной цепью управления, по-видимому, целесообразно применять для переключения блоков SID с рабочим напряжением <20 кВ.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Efanov V.M., Kardo-Sysoev A.F., Tchashnikov I.G., Yarin P.M. // Proc. of 1996 International Power Modulator Symposium. FL, USA, Boca Raton, 1996. P. 22. https://doi.org/10.1109/MODSYM.1996.564440
- Grekhov I., Korotkov S., Rodin S. // IEEE Trans. on Plasma Science. 2008. V. 36. № 2. Part 1. P. 3782. https://doi.org/10.1109/TPS.2008.918661
- 3. *Gusev A.I.*, *Lyubutin S.K.*, *Rukin S.N.*, *Tsyranov S.N.* // IEEE Trans. on Plasma Science. 2016. V. 44. № 10. Part 1. P. 1888. https://doi.org/10.1109/TPS.2016.2542343
- 4. *Grekhov I., Kardo-Sysoev A.* // Soviet Technical Physics Letters. 1979. V. 5. № 8. P. 395.

- 5. Коротков С.В., Аристов Ю.В., Воронков В.Б. // ПТЭ. 2019. № 2. С. 24. https://doi.org/10.1134/S0032816219010130
- 6. Коротков С.В., Аристов Ю.В., Жмодиков А.Л., Коротков Д.А. // ПТЭ. 2020. № 5. С. 75. https://doi.org/10.31857/S0032816220050171
- 7. Korotkov S.V., Aristov Yu.V., Korotkov D.A., Zhmodikov A.L. // Review of Scientific Instruments. 2020. V. 91. Art. 084704. https://doi.org/10.1063/5.0015284
- 8. *Коротков С.В., Аристов Ю.В., Коротков Д.А.* // ПТЭ. 2022. № 5. С. 70. https://doi.org/10.31857/S003281622205007X
- 9. *Grekhov I., Efanov V., Kardo-Sysoev A., Shenderey S. //* Solid State Electronics. 1985. V. 28. № 6. P. 597. https://doi.org/10.1016/0038-1101(85)90130-3
- 10. *Korotkov S., Aristov Yu., Zhmodikov A.* // IEEE Trans. on Plasma Science. 2022. V. 50. № 4. P. 954. https://doi.org/10.1109/TPS.2022.3156386J
- 11. Sanders J., Kuthi A., Gundersen M.A., Moore W.H. Patent No. US 8, 115, 343 B2. 2012.
- 12. Грехов И.В., Жмодиков А.Л., Коротков С.В., Прижимнов С.Г., Фоменко Ю.Л. // ПТЭ. 2016. № 3. С. 32. https://doi.org/10.1134/S0020441216020202